Se	arcn	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/769,684	BONILLA ET AL.	
Examiner	Art Unit	_
Leon J. Harper	2166	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
707	104.1,100, 10,1,5	9/7/2006	LJH
		-	
			-

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
·	1		

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
•	DATE	EXMR
	ľ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
•		·
		*
•		
•		